英国Aquila

高级薄膜测定系统

通过对薄膜和基片的透射光谱和反射光谱的测量，利用分析软件得出薄膜和基片的折射率(n)、吸收系数(k)和薄膜厚度(d)

★数据分析时间：5秒-5分钟，取决于数据的复杂程度
★光谱范围：280-2200nm
★厚度：1nm-25um
★薄膜：介质、聚合物、半导体金属等
★基片：透明、半透明、半吸收等

芬兰Bio-Navis

Bio-Navis表面等离子体共振

利用表面等离子体谐振技术能够测量浓度、折射率变化、厚度变化、相对聚焦/解离速率、平衡常数、薄膜中的静电场等

主要应用于：分子生物研究、医学研究、蛋白质工程、生物传感器、LB、自组装、吸附动力学、表面分子相互作用研究

★双液体和双光学通道
★光学灵敏度Dn=10-5-10-6
★温度恒定独立的流动池
★大的角度范围可以在气体和液体环境下进行
★客户化的软件

英国Millbrook

二次离子质谱仪

二次质谱仪(SIMS)是全面和最前沿的表面分析技术。揭示了极表面和近表面原子层化学组成。固定SIMS，影像SIMS和深度刻蚀表面显示表层下的组成(动态SIMS)分析可以得到：

★单分子层水平表面信息
★元素监测
★表面污染、有机物质鉴定
★高灵敏度分析
★快速化学组分成像
★薄膜深度分析
★放置方便、操作简单经济适用、设计合理

法国CAD

固体与薄膜电位分析仪

Zeta电位分析仪用多孔毛细管技术测量流动电势。适用于平面上粒径>50μm的颗粒、纤维以及平面

主要特征:

★在线电导率测量池，保证了Zeta电位的精确计算
★实时压差Vs电压图表
★直接计算Zeta电位
★数据在Excel下直接转移处理测量池孔大小可变，标准测量池直径15mm
★电压精度0.1μV
★压差范围 500mBar

英国Farfield

双偏振干涉分子分析系统

DPI是基于Thoms Yiong干涉发明，干涉信号经过数学转换可得到传感面厚度、密度及质量的信息

★密度变化：0.1pg/mm2
★厚度变化0.1A

应用：蛋白质结构表征和检测及其在固-液界面的吸附聚集行为、蛋白质与生物分子或配体相互作用、核酸分子在表面的固定互补杂交过程、模拟生物膜与蛋白质等相互作用、生物纳米结构、生物大分子研究领域

英国MML

纳米力学性能测试系统

纳米划痕和磨损测试，纳米冲击和疲劳测试，以及在高温和液体环境中的测试测量数据：硬度、模量、蠕变应力应变曲线、塑性指数、塑性功、弹性模量、纳米磨损性能、划痕临界载荷、表面摩擦及形貌图、粘结失效、断裂韧性、冲击性能、接触疲劳强度。可750° 高温测量。

位移热漂移：0.01nm/s500℃静态动态压痕测量，横向设计消除了浮力、重力的影响。

电话：028-85109010　　邮箱：cdxh_rc@163.com